

Patent Number:

JP8111286

Publication date:

1996-04-30

Inventor(s):

ARAI MICHIO; NAKATANI KENJI; NANBA NORIYOSHI

Applicant(s):

TDK CORP

Requested Patent:

☐ JP8111286

Application Number: JP19940244243 19941007

Priority Number(s):

IPC Classification:

H05B33/14; C09K11/06; H05B33/04

EC Classification:

Equivalents:

JP3577117B2

Abstract

PURPOSE: To produce a protection film having good step coverage by forming a film by the ECR plasma CVD method.

CONSTITUTION: A transparent electrode 1 consisting of ITO etc., is formed on a glass base board 10, and thereon a positive hole implantation conveyance layer 2, light emission layer 3, electron implantation conveyance layer 4, cathode 5, and Si layer 6 are laid one over another. Thereon a protection layer 7 consisting of SiO2 or Si3 N4 is formed by the ECR plasma CVD method. The layer 2 is formed by vapor deposition of a derivative of tetraaryl diamine or N,N'-di-(3-methylphenyl)-N,N'-diphenyl-4,4'-diamino-1,1' biphenyl. The light emission layer 3 consists of a mixture of a component of the layer 2, for example derivative of tetra-aryl diamine, and a component of the layer 4, for example aluminum tris(8quinolinolate). The layer 4 is formed by vapor deposition of aluminum tris(8-quinolinolate), etc. The cathode 5 is formed from material having small work function such as MgAg, MgIn, etc.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

特開平8-111286

(43)公開日 平成8年(1996)4月30日

(51) Int.CL*

證別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

H 0 5 B 33/14

C09K 11/06

Z 9280-4H

H 0 5 B 33/04

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

(22)出顧日

特願平6-244243

平成6年(1994)10月7日

(71)出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72)発明者 荒井 三千男

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(72)発明者 中谷 賢司

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(72)発明者 南波 意良

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(74)代理人 弁理士 山谷 略榮 (外2名)

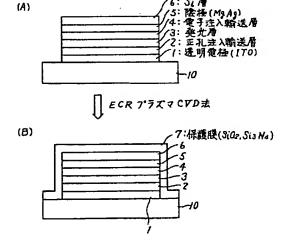
(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネセンス素子の製法

(57)【要約】

【目的】 有機EL紫子においてステップカバレージの 良好な保護膜を提供すること。

【構成】 電子注入手段4と、正孔注入手段2と、陽極1と、陰極5と、保護膜を具備する有機エレクトロルミネセンス素子において、保護膜7をECRプラズマCV D法により被覆したことを特徴とする。

本発明の一実施例



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子注入手段と、正孔注入手段と、陽極 と、陰極と、保護膜を具備する有機エレクトロルミネセ ンス素子において.

保護膜をECRブラズマCVD法により被覆したことを 特徴とする有機エレクトロルミネセンス素子の製法。

【請求項2】 前記保護膜がSiO, またはSi, N. により構成されることを特徴とする請求項1記載の有機 エレクトロルミネセンス素子の製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は有機エレクトロルミネセ ンス (EL) 素子に係り、特にその寿命を長くするため の保護膜の製法に関する。

[0002]

*

$$(R_{a})_{\Gamma_{a}}$$

$$(R_{a})_{\Gamma_{a}}$$

$$(R_{a})_{\Gamma_{a}}$$

$$(R_{a})_{\Gamma_{a}}$$

$$(R_{a})_{\Gamma_{a}}$$

$$(R_{a})_{\Gamma_{a}}$$

[0005] [化1において、R1、R1、R1、R7 及びR 、はそれぞれアリール基、アルキル基、アルコキシ基、 アリールオキシ基、アミノ基又はハロゲン原子を表す。 r1、r2、r3及びr4は、それぞれ0又は1~5の 30 整数である。R、及びR。は、アルキル基、アルコキシ 基、アミノ基又はハロゲン原子を表し、これらは同一で も異なるものであってもよい。 г 5 及び г 6 はそれぞれ 0又は1~4の整数である。〕

発光層3としては、トリス(8-キノリノラト)アルミ ニウム等の金属錯体色素、テトラフェニルブタジェン、 アントラセン、ペリレン、コロネン、12-フタロペリ ノン誘導体、キナクリドン、ルブレン、スチリル系色素 等の有機蛍光体や前記化1で示すテトラアリールジアミ ン誘導体と、後述する電子注入輸送層4で使用される化 40 る。 合物、例えばトリス(8-キノリノラト)アルミニウム との混合物などが使用される。

【0006】電子注入輸送層4としては、例えばトリス (8-キノリノラト)アルミニウム等の金属錯体色素、 オキサジアゾール誘導体、ペリレン誘導体、ピリジン誘 導体、ピリミジン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリ ン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオ ロレン誘導体等が使用される。陰極5としては、仕事関 数の小さい材料、例えばLi、Na、Mg、Al、A g、【n、あるいはこれらの1種以上を含む合金例えば 50 【0010】

* 【従来の技術】有機EL素子は、薄形の新しい発光源と して注目されている。従来の有機EL素子は、図3に示 す如く、ガラス基板10上にITOからなる透明電極1 を形成し、この上に正孔注入輸送層2、発光層3、電子 注入輸送層4. 陰極5等を形成することにより構成され ている。

7

【0003】正孔注入輸送層2としては、例えば下記化 1で表されるテトラアリールジアミン誘導体や、それ以 外の芳香族三級アミン、ヒドラゾン誘導体、カルバゾー 10 ル誘導体、トリアゾール誘導体、イミダゾール誘導体、 アミノ基を有するオキサジアゾール誘導体、ポリチオフ ェン等を使用する。

[0004]

(化1)

MgAg (例えば重量比10:1)、MgIn等を使用 する。

【0007】ところで、前記の如く構成された有機EL 素子は、最初は強く発光しているが、時間が経過するに つれて発光強度が急速に減少するという欠点がある。本 発明者はこの欠点を改善すべく研究したところ、これが 陰極の構成材料にMgが存在するため、非常に酸化し易 いことにもとづくことを解明し、陰極が酸化され難いよ うな保護膜を具備した、図4に示す如き、有機EL素子 を開発した。

【0008】即ち、図4に示す如く、陰極5をSi層6 でコーティングし、このSi層6を更にSiOz、Si , N. 等で構成される保護膜7でカバーするものであ

[0009]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前記の如 く、SiO,あるいはSi,N.等で構成された保護膜 7はスパッタリング法で設けている。しかしこのような 保護膜7をスパッタリング法で設けると、ステップカバ レージがよくない。そのため、保護膜7の膜厚を大きく しなければならないという問題が存在する。従って本発 明の目的は、このような問題を解決するため、ステップ カバレージのよい保護膜の製法を提供することである。

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた め、本発明では、図1(A)に示す如く、ガラス基板1 0上に積層された、透明電極1、正孔注入輸送層2、発 光層3、電子注入輸送層4、陰極5、Si層6で構成さ れる有機EL体に対し、ECRプラズマCVD法によ り、SiO、又はSi, N、よりなる保護膜7を形成す る。

[0011]

【作用】これにより図1 (B) に示す如く、略均一の厚 さの保護膜7が形成された有機EL索子を得ることがで 10 1、1′ビフェニルを蒸着することにより形成される。 きる。

[0012]

【実施例】本発明の一実施例を図1及び図2に基づき説*

【0015】発光層3は、前記正孔注入輸送層2を構成 する例えば化1で表されるテトラアリールジアミン誘導 体と、後述する電子注入輸送層4を構成する例えばトリ ス(8-キノリノラト)アルミニウムとの混合物が使用 される。この場合、異なる蒸着源より蒸発させる共蒸着 が好ましいが、これに限定されるものではない。勿論他 の蛍光性物質を含ませることもできる。

【0016】電子注入輸送層4は、例えばトリス(8-キノリノラト)アルミニウムを蒸着することにより形成 30 される。陰極5は、仕事関数の小さい材料で構成され、 例えばMgAgで構成されるが、MgInを使用すると ともできる。陰極5は蒸着又はスパッタリングにより成 膜される。

【0017】Si層6は、陰極5をコーティングして酸 化を防止するものであり、Siをスパッタリングすると とで、約1000人の厚さに成膜される。この条件を下 記に示す。

[0018]

温度

宰温

パワー

50~500W

キャリアガス

Αr

0.01 Torr

圧力 DC

保護膜7はSi層6をコーティングして更に陰極5の酸 化を防止するものであり、SiO、あるいはSi、N。 等で構成され、例えば図2に示す如きECRブラズマC VD装置により形成される。

【0019】図2に示すECRプラズマCVD装置につ いて説明する。図2において、11は反応室、12は保 50 場合の条件を下記に示す。

*明する。図1は本発明により製造された有機EL素子の 説明図、図2は本発明の有機EL素子が具備する保護膜 の製法に使用するECRブラズマCVD装置である。 【0013】透明電極1は陽極となるものであり、例え ばITO等で構成され、ガラス基板10上に蒸着又はス パッタリングにより成膜される。正孔注入輸送層2は、 前記化1で表されるテトラアリールジアミン誘導体や、 下記化2で表されるN、N′-ジ(3-メチルフェニ

ル) -N、N' -ジフェニル-4、4' -ジアミノー [0014]

(化21

持板、13は排気穴部、14はガス流入管、15は磁場 発生用コイル、16は導波管状外壁、17は支持桿、1 8は冷却管、19は交流電源、20はコンデンサ、30 は有機EL体である。

[0020] 反応室11内の保持板12上には、例えば 図1(A) に示す如き有機EL体30が保持される。反 応室11は、排気穴部13から、図示省略された真空ボ ンプで排気され、所定の圧力に減圧されるものである。 【0021】保持板12は支持桿17により支持されて いる。そしてこの支持桿17内には冷却管18が配置さ れ、冷却媒体をを流入排出することにより保持板12を 所定の温度に冷却可能にしている。

【0022】後述する反応に使用されるガスはガス流入 管14により反応室11内に導入される。磁場発生コイ ル15は直流で励磁してECRプラズマ用を所定領域に 発生させるための直流磁場を発生するものである。

【0023】導波管状の外部壁16にはマイクロ波が入 カされ、ECR (ElectronCyclotron Resonance)プラズマを発生するものであ る。有機EL体30にSiO,の保護膜7を形成する場 合の条件を下記に示す。

[0024]

温度

30°C~100°C

圧力

10mTorr 10SCCM

S i H.

O,

20SCCM

Power 2. 45GHZ (1KW)

また有機EL体30にSi, N∴の保護膜7を形成する

[0025]

温度

30°C~100°C

圧力

10mTorr

S i H.

10SCCM

NH,

15SCCM

Power 2. 45GHZ (1KW)

図2 に示すECRプラズマCVD装置において、前記条 件で反応ガスを反応室11内に流入し、また導波管状の 外部壁16から2.45GHZのマイクロ波を入力し、 磁場発生コイル 15 により磁場を印加すると、図2にお 10 いて傾線で示すように、保持板12の上部近傍にECR ブラズマが限定発生され、これによりSiO, あるいは Si, N, の保護膜7が、図1(B) に示す如く、ステ ップカバレージが良好で均一の厚さに形成することがで きる。しかも前記の如く、低温で、正孔注入輸送層2、 発光層3、電子注入輸送層4等に悪影響を与えない温度 で、保護膜を形成することができる。

【0026】なお、前記実施例では、有機EL素子とし て正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の3層構成 の場合について説明したが、本発明はこれに限定される 20 12 保持板 ものではない。例えば正孔注入輸送層・発光層+電子注 入輸送層、正孔注入輸送層+電子注入輸送層・発光層の 如きものに対しても同様に適用できる。また1つの電子 注入手段が、発光層及び正孔注入手段を兼ねる場合も本 発明に含まれるものである。

[0027]

(A)

[発明の効果]請求項1に記載された本発明によれば、 ECRプラズマCVD法により保護膜を形成したので、 ステップカバレージの良い保護膜を、低温で形成すると とができる。

* [0028] 請求項2に記載された本発明によれば、E CRプラズマCVD法により保護膜をSiO、又はSi , N. により形成したので、長時間安定して発光する有 機Eし素子を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例説明図である。

【図2】ECRプラズマCVD装置の1例である。

【図3】従来の有機EL素子を示す。

【図4】従来の有機EL素子を改良したものを示す。

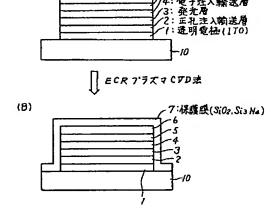
【符号の説明】

- 1 透明電極
- 正孔注入輸送層
- 3 発光層
- 4 電子注入輸送層
- 陰極
- 6 Si層
- 7 保護膜
- 10 ガラス基板
- 11 反応室
- - 13 排気穴部
- 14 ガス流入管
- 15 磁場発生用コイル
- 16 導波管状外壁
- 17 支持桿
- 18 冷却管
- 19 交流電源
- 20 コンデンサ
- 30 有機EL体

***30**

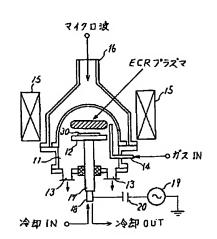
[図1]

本発明の一実施例



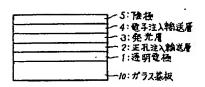
【図2】

ECRプラズマCYD装置



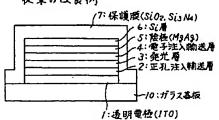
【図3】

從耒例



【図4】

従来の改良例



[公報種別] 特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分] 第7部門第1区分 【発行日】平成14年1月18日(2002.1.18)

【公開番号】特開平8-111286

[公開日] 平成8年4月30日(1996.4.30)

[年通号数]公開特許公報8-1113

[出願番号]特願平6-244243

【国際特許分類第7版】

HO5B 33/14

C09K 11/06

H05B 33/04

[FI]

H05B 33/14

C09K 11/06

H05B 33/04

【手続補正書】

[提出日] 平成13年7月23日(2001.7.2 3)

7

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】電子注入手段と、正孔注入手段と、陽極と、陰極と、保護膜を具備する有機エレクトロルミネセンス素子において、

有機エレクトロルミネセンス素子に悪影響を与えない低 温度範囲で、CVD法を用いて保護膜を形成したことを 特徴とする有機エレクトロルミネセンス素子の製法。

【請求項2】 <u>電子注入手段と、正孔注入手段と、陽極と、</u>陰極と、保護膜を具備する有機エレクトロルミネセンス素子において、

保護膜をECRプラズマCVD法により被覆したことを 特徴とする有機エレクトロルミネセンス素子の製法。

【請求項3】 前記保護膜がSiO, またはSi, N. により構成されることを特徴とする請求項2記載の有機エレクトロルミネセンス素子の製法。

【請求項4】 前記保護順を被覆するまえに、陰極をコーテングしてその酸化を防止するSi層を形成したことを特徴とする請求項3記載の有機エレクトロルミネセンス素子の製法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0027

【補正方法】変更

【補正内容】

[0027]

[発明の効果] <u>本発明によれば</u>、ECRプラズマCVD 法により保護膜を形成したので、ステップカバレージの 良い保護膜を、低温で形成することができる。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0028

【補正方法】変更

【補正内容】

【0028】本発明によれば、ECRブラズマCVD法により保護膜をSiO、又はSi,N。により形成したので、長時間安定して発光する有機EL素子を提供することができる。